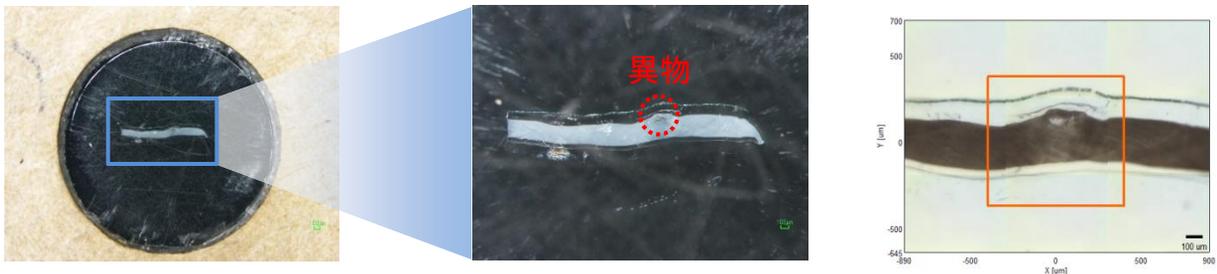


埋没した異物を含む多層フィルムの広域マッピング測定

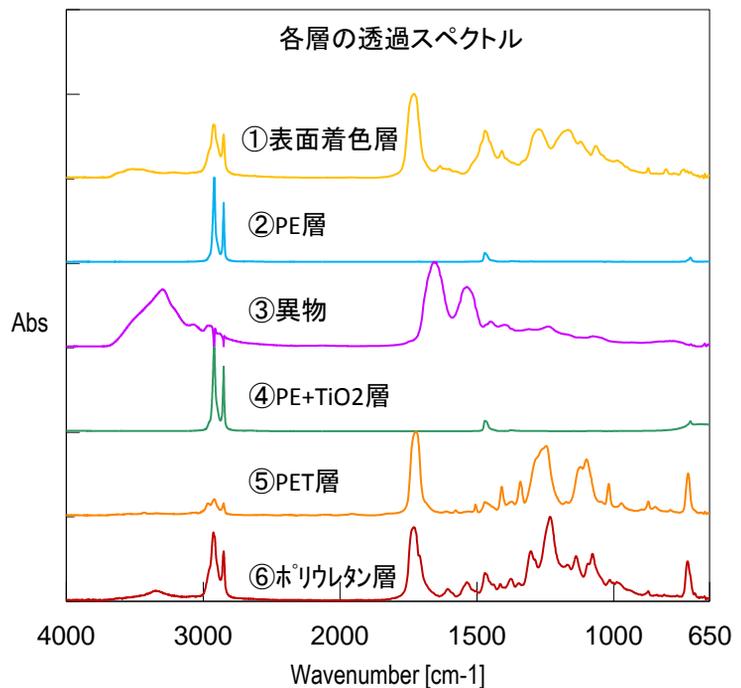
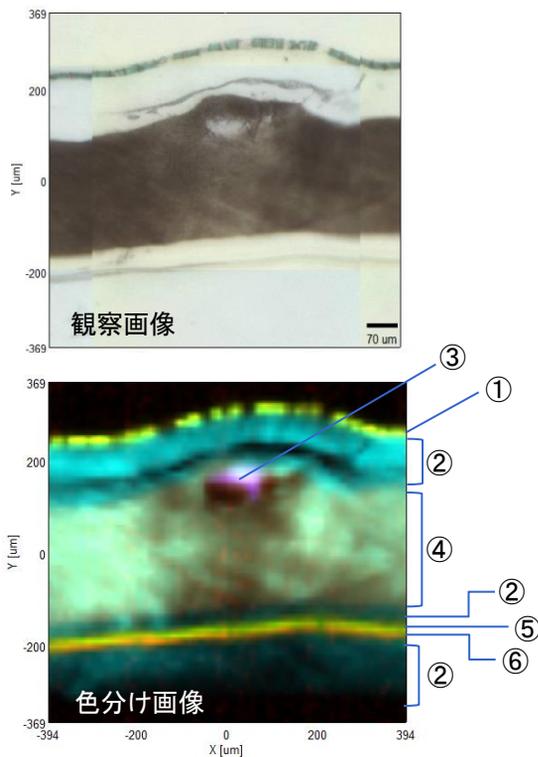
多層フィルムの製造工程において、異物が発生した場合、層と層の間に異物が埋没していることがあります。異物を含む部分の切片を切り出すことで、どの層に異物が埋まっているかを調べることが可能です。φ8ClearDiskとKBrプレートを利用することで広く平滑な測定面を得ることが出来ます。



異物を含む多層フィルムの切片をφ8ClearDiskで加圧成形

KBrプレート化した試料切片の様子
(実体顕微鏡の観察画像)

赤外顕微鏡による
観察画像と測定領域



Condition

顕微透過法, 12.5 × 12.5 μm, 64 × 60点,
分解 4cm⁻¹, IRT-7000 シリーズ リニアアレイ検出器

Master's Memo

- フィルムと異物を同時にサンプリングすることにより、異物の組成、存在部位を同時に調べることができます。